Документ полтисан простой алектронной полтиство НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректо **Редеральное** государственное автономное образовательное учреждение Дата подписания: 31.07.2023 16:26:06 высшего образования

Уникальный про**фрациональный исследовательский технологический университет «МИСИС»** d7a26b9e8ca85e98ec3de2eb454b4659d061f249

# Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

# Математические методы моделирования физических процессов

Закреплена за подразделением Кафедра материаловедения полупроводников и диэлектриков

Направление подготовки 22.03.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ

Профиль

 Форма обучения
 очная

 Общая трудоемкость
 3 ЗЕТ

Часов по учебному плану 108 Формы контроля в семестрах:

в том числе: зачет с оценкой 8

 аудиторные занятия
 48

 самостоятельная работа
 60

### Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	8 (4.2)		Итого	
Недель	12			
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ
Лабораторные	24	24	24	24
Практические	24	24	24	24
Итого ауд.	48	48	48	48
Контактная работа	48	48	48	48
Сам. работа	60	60	60	60
Итого	108	108	108	108

УП: 22.03.01-БМТМ-22.plx cтр.

	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ
1.1	Цель освоения дисциплины – формирование компетенций, в соответствие с учебным планом;
1.2	сформировать у обучающегося набор знаний необходимый для математической постановки и последующего
	произведения математического исследования физических процессов.

	2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ							
	Блок ОП:	Б1.В.ДВ.20						
2.1	Требования к предва	рительной подготовке обучающегося:						
2.1.1	Атомное строение фаз							
2.1.2	Биохимия наноматериалов							
2.1.3	Инженерия поверхности							
2.1.4	Квантовая и оптическая электроника							
2.1.5	Методы исследования физических свойств полупроводниковых структур							
2.1.6	Методы получения наночастиц и наноматериалов							
2.1.7	Мехатроника							
2.1.8	Наноструктурные термоэлектрики							
2.1.9	Основы компьютерной металлографии							
2.1.10	Основы магнетизма. Ч	асть 1. Физика магнетизма						
2.1.11	Основы физики поверхности							
2.1.12	Термодинамика и кине	тика аморфизирующихся систем						
2.1.13		оких давлений, фазовые превращения в углероде и нитриде бора						
2.1.14	Физика полупроводни	ковых приборов						
2.1.15	Физика прочности	• •						
2.1.16	-	ов и неметаллических материалов						
2.1.17		нно-контролируемые процессы						
2.1.18	Материаловедение							
2.1.19	=	упроводников и диэлектриков						
2.1.20	Металловедение инног							
2.1.21	Методы исследования	*						
2.1.22		гизация цифровых технологий в материаловедении и металлургии						
2.1.23	= =	ские измерения функциональных материалов						
2.1.24	_	изация и технические измерения						
2.1.25		изация и технические измерения в электронике						
2.1.26		ения и методов исследования материалов						
2.1.27	-	ктика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности						
2.1.28		ктика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности						
2.1.29		ктика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности						
2.1.30	Производственная пра	ктика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности						
2.1.31	Разработка новых мате	риалов						
2.1.32	Технология функциона	альных материалов						
2.1.33	Фазовые равновесия и	дефекты структуры						
2.1.34	Физика диэлектриков							
2.1.35	Физика полупроводни	КОВ						
2.1.36	Введение в квантовую	теорию твердого тела						
2.1.37	Дефекты кристалличес	кой решетки						
2.1.38	Компьютеризация экст	перимента <u>перимента</u>						
2.1.39	Планирование и организация научно-исследовательской работы							
2.1.40	Планирование научног	го эксперимента						
2.1.41	Теория поверхностных явлений							
2.1.42	Теория симметрии							
2.1.43	Электроника							
2.1.44	Кристаллография							
2.1.45	Методы математическо	ой физики						
	I							

'П: 22.03.01-БМТМ-22.plx cтр. 3

2.1.46	Практическая кристаллография
2.1.47	Физическая химия
2.1.48	Информатика
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
	предшествующее:

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

## ПК-1: Способен осуществлять обработку и анализ научно-технической информации и результатов исследований

#### Знать:

ПК-1-31 Различные среды математического моделирования

ОПК-5: Способен решать научно-исследовательские задачи при осуществлении профессиональной деятельности с применением современных информационных технологий и прикладных аппаратно-программных средств, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения задач в профессиональной области

#### Знать:

ОПК-5-32 Физические принципы, законы и теории.

ОПК-5-31 Основные физические явления и их модели необходимые для освоения существующих технологических процессов в области полупроводниковой промышленности и разработки новых технологических подходов.

## ПК-1: Способен осуществлять обработку и анализ научно-технической информации и результатов исследований

#### Уметь:

ПК-1-У1 Строить математические модели для описания физических процессов

ОПК-5: Способен решать научно-исследовательские задачи при осуществлении профессиональной деятельности с применением современных информационных технологий и прикладных аппаратно-программных средств, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения задач в профессиональной области

### Уметь:

ОПК-5-У1 Выявлять существенные признаки физических явлений.

ОПК-5-У2 Осуществлять моделирование физических процессов

# ПК-1: Способен осуществлять обработку и анализ научно-технической информации и результатов исследований

### Владеть:

ПК-1-В1 Методами вычислительной математики необходимыми для проведения моделирования физических процессов с использованием вычислительной техники

ОПК-5: Способен решать научно-исследовательские задачи при осуществлении профессиональной деятельности с применением современных информационных технологий и прикладных аппаратно-программных средств, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения задач в профессиональной области

## Владеть:

ОПК-5-В1 Методом размерностей для выявления функциональной зависимости